



(10) **DE 10 2009 020 115 A1** 2010.11.25

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2009 020 115.7**

(22) Anmeldetag: **06.05.2009**

(43) Offenlegungstag: **25.11.2010**

(51) Int Cl.<sup>8</sup>: **G01B 11/16** (2006.01)

**G01D 5/353** (2006.01)

**G01M 11/02** (2006.01)

**G02B 6/00** (2006.01)

(71) Anmelder:  
**Bundesanstalt für Materialforschung und  
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, DE**

(74) Vertreter:  
**Zimmermann & Partner, 80331 München**

(72) Erfinder:  
**Lenke, Philipp, 10247 Berlin, DE**

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht  
gezogene Druckschriften:

**US 2006/02 39 330 A1**

**DE 698 31 405 T2**

**GB 21 90 186 A**

**US 75 39 361 B1**

**US 48 23 166 A**

**Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen**

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: **Fehlerkorrekturverfahren für einen faseroptischen Sensor und Meßvorrichtung**

500

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Fehlerkorrekturverfahren für einen faseroptischen Sensor bereitgestellt, wobei das Fehlerkorrekturverfahren das Bereitstellen von Rückstreu-Meßdaten einer optischen Polymerfaser, das Ermitteln eines gemessenen Streuprofiles aus den Rückstreu-Meßdaten, das Bereitstellen eines Modells der optischen Polymerfaser, wobei das Modell angepaßt ist, einen Zeitverlauf des Rückstreuverhaltens der optischen Polymerfaser zu beschreiben, das Ermitteln des Zeitverlaufs des Rückstreuverhaltens anhand des Modells und das Kompensieren des ermittelten Zeitverlaufs des Rückstreuverhaltens umfaßt.

